

# SpecMetrix® FWS

## 膜重测试站

## 膜重测试站系统

SpecMetrix® 膜重测试站为实验室提供非接触式、非破坏性、实时的薄膜重量和涂层厚度测量数据。

SpecMetrix® 膜重测试站提供了非接触、非破坏性、实时的离线厚度测量测试，适用于涂层样品和平板薄膜。膜重测试站具有高度精确和快速的特点，通过单点和扫描模式进行厚度测试。

SpecMetrix® 膜重测试站旨在简化质量控制测试，并改善对膜重和涂层厚度的过程控制。由于其无与伦比的能力，能够以亚微米级精度识别和量化绝对膜重厚度，它是我们首选的实验室测量工具之一。

膜重测试站系统加速了离线薄膜测试，并改善了来料和成品检验。

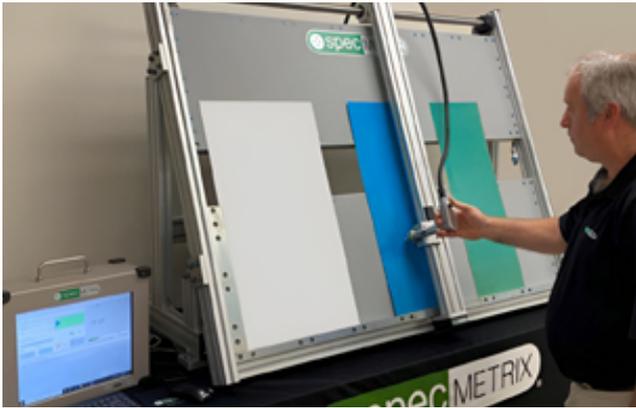


## 设备特点与优势：

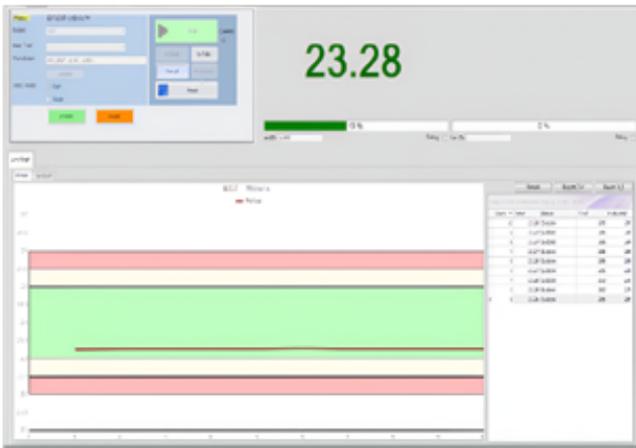
- **灵活快速**  
模块化设计，具备从质量控制实验室到生产车间的即时膜重测量能力。
- **非接触式**  
测量过程中不接触涂层或基材，保持样品和部件的完整性。
- **绝对厚度测量**  
超高精度的实时涂层和膜厚度测量，加速样品测试、数据收集和质量分析。
- **基材独立**  
适用于湿样或干样的透明、有色或着色基材的测量。
- **广泛应用**  
实时测量单层或双层涂层，精度达到亚微米级。
- **无危害性**  
采用独特的非放射性和非侵入性的 ROI 和 EXR 增强光学干涉技术。
- **环保**  
非破坏性测试方法有助于减少废料、返工劳动力和能源成本。
- **强大的SensorMetric软件**  
用户友好的软件包自动将所有数据存储到Excel®或工厂网络中。

## 可选系统配置：

- 用于定期在线使用的增强型实验室系统
- 用于连续测量的在线系统
- 半自动和全自动 ACS 容器涂层质量保证系统
- X-Y 附件用于离线测量干燥板材或卷材样品



▲ 膜重测试站具有高度精确和快速的特点，在单点和扫描模式下提供高精度、非接触式厚度测试。



▲ 在扫描模式下，测量是在给定的时间内进行的。最终结果是测量值的平均值。

### 免责声明

本档中包含的信息可能会根据经验和我们持续产品开发的政策不时修改。请查看工业物理 Industrial Physics 网站以获取最新版本。

### 技术规格:

测量范围	0.2至250微米（涂层厚度）
精度	涂层厚度的±1%（标称值）* <small>*基于使用NIST可追溯的厚度标准进行的整个测量范围（0.2至250微米）的精度验证</small>
测量速度	每秒最多100次
温度范围	0° 至45° C
输出指标	微米、密耳、mg/in <sup>2</sup> 、mg/4in <sup>2</sup> 、g/m <sup>2</sup> 、mg/cm <sup>2</sup> 、lbs/令
操作系统	Windows® 平台
制造	美国制造
认证	CE (C) (E) (S) (P) (U) (L)

Industrial Physics 工业物理

电话：400 878 1858

邮箱：info.china@industrialphysics.com

网址：www.industrialphysics.cn

www.industrialphysics.com

